



ViEW2008 ビジョン技術の実利用ワークショップ

<http://www.tc-iaip.org/view2008/>

開催日：2008年12月4日(木)、5日(金)

会場：パシフィコ横浜 アネックス・ホール(横浜市西区みなとみらい1-1-1)

ViEW(Vision Engineering Workshop)は、横浜ベイエリアで開催される恒例行事として春のSSII、秋のViEW(ビュー)として親しまれております。本ワークショップは、これまで19年間に亘り日本における「ものづくり」を支える生産技術に関わる画像処理応用技術の発信源として貢献してまいりました。最近では、外観検査、部品識別などの生産ラインばかりでなく、安全やセキュリティなど社会システムまで画像処理、マシンビジョンの応用分野が着実に広がっております。このような中で、ViEWは、最先端の研究結果の発表の場として、産業界と大学・研究機関の皆様の意見交換、情報収集の場として、画像技術発展の一翼を担っております。

毎回、特別講演、パネル討論などで画像技術の実利用に関する最新の話題が提供され、各界から500名ほどの皆様にご参加頂いておりますが、本年も、口頭発表とインタラクティブセッションの両方で成果を発表するハイブリッドオーラルという新しい発表方式を引き続き採用します。また、基調講演と一般講演をテーマ別に組み合わせさせたシングルトラックのセッション構成により、参加者全員が一堂に会して討論し、最新の情報を共有することを計画しております。

産・官・学のすべての研究者、技術者ばかりでなく画像処理とその応用技術に関心をお持ちの皆様の参加を心からお待ち申し上げます。

スコープ： ワークショップの募集する対象分野を示します。ただし、応募対象はこれらに限られるものではありません。

[アプリケーション]

・外観検査、欠陥検査、非破壊検査
・ロボット、マシンビジョン
・環境認識、実環境センシング

・高度情報交通システム、運転支援
・監視、セキュリティ応用
・認証のためのビジョン

・映像情報処理、メディア処理
・ヒューマン・インターフェース応用
・画像応用の新しい応用

[テクノロジー]

・画像応用システム
・イメージセンサ、デバイス
・画像処理ハードウェア、アーキテクチャ

・光学的画像処理・計測
・画像パターン認識、アルゴリズム
・3次元画像処理、距離画像認識

・動画像処理、動きの検出・計測
・カラー画像情報処理
・感性画像計測、感性情報処理

主催： 精密工学会

共同企画： 画像応用技術専門委員会、知能メカトロニクス専門委員会(精密工学会)、マシンビジョンのハイブリッド化技術調査専門委員会、非整備環境におけるパターン認識技術の応用分野拡大協同研究委員会(電気学会)、パターン計測部会(計測自動制御学会)、画像処理特別研究委員会(日本非破壊検査協会)

協賛： 電気学会、計測自動制御学会、情報処理学会、日本ロボット学会、電子情報通信学会、エレクトロニクス実装学会、センシング技術応用研究会、日本電気制御機器工業会、日本非破壊検査協会、アドコム・メディア(旧 精機通信社)、映像情報インダストリアル

同時開催： 国際画像機器展(12月3、4、5日) 連絡先：アドコム・メディア(旧 精機通信社) TEL:03-3367-0571

実行委員会： 橋本周司(早稲田大;委員長)、佐藤雄隆(産総研;幹事)、山口友之(早稲田大;幹事補佐)、青木義満(慶應大)、斎藤英雄(慶應大)、佐藤敦(NEC)、諏訪正樹(オムロン)、立川道義(リコー)、寺田賢治(徳島大)、内藤貴志(豊田中研)、中島慶人(電力中研)、野口稔(日立ハイテクノロジーズ)、野村安國(ファースト)、橋本学(中京大)、藤原伸行(明電舎)、堀修(東芝)、前田俊二(日立製作所)、望月貴裕(NHK 技研)

プログラム委員会： 榎澤信(旭硝子;委員長)、山下淳(静岡大;幹事)、藤原孝幸(中京大;幹事補佐)、石井明(香川大)、岩田健司(産総研)、海老澤嘉伸(静岡大)、大恵俊一郎(徳島大)、大城英裕(大分大)、小沢慎治(愛知工科大)、加藤邦人(岐阜大)、駒野目裕久(池上通信機)、佐藤洋一(東大)、清水有子(日本電子)、下村倫子(日産自動車)、白井良明(立命館大)、高橋悟(香川大)、中野宏毅(日本IBM)、中野倫明(名城大)、山口修(東芝)、芦ヶ原隆之(ソニー)

アドバイザーボード： 斎藤之男(東京電機大)、石井明(立命館大)、岡昌世(元池上通信機)、秦清治(香川大)、原靖彦(日本大)、輿水大和(中京大)、中川泰夫(日立)、角田興俊(東京電機大)、山本和彦(岐阜大)

組織委員会： 金子俊一(北大;委員長)、牛田善喜(隆祥産業)、青木公也(中京大)、馬場充(茨城大)、浅野敏郎(広島工大)、伊藤裕(東京電機大)、梅田和昇(中央大)、梶谷誠(電通大)、加藤章(中部大)、北川克一(東レエンジニアリング)、肥塚哲男(富士通研)、坂上勝彦(産総研)、渋谷久恵(日立)、清水毅(山梨大)、白川弘明(福岡工大)、菅泰雄(慶應大)、高橋一哉(日立)、田口亮(武蔵工大)、塚田弘志(東芝)、中村明生(東京電機大)、西川喜八郎(西川技術士事務所)、前田祐司(古川製作所)、明愛国(電通大)、村上俊之(慶應大)、山本新(名城大)

講演申込み：

期限： 講演申込 2008年8月29日(金)、原稿提出 2008年10月17日(金)

申込方法： 7月頃からViEW2008ホームページ(<http://www.tc-iaip.org/view2008/>)からオンライン申込できます。講演1件につき代表者の方がご登録下さい。登録時にA4一枚程度の講演概要を送信いただきます。また、講演題目、希望講演形式(オーラル、ハイブリッドオーラル、インタラクティブの別)、講演者氏名(協賛組織会員/非会員/学生の別)、講演者所属、連絡者氏名、連絡者の所属、連絡先住所(郵便が届く内容)、電話、FAX・E-MAIL等の情報をご入力いただきます。詳しくはホームページをご覧ください。なお、オンラインでの登録が困難な場合は、下記までご相談下さい。

問い合わせ先： 画像応用技術専門委員会事務局 ViEW2008係 〒182-0026 調布市小島町1-11-6 エンケ102 (株)キャンパスクリエイト内
TEL: 080-1076-0019 FAX: 020-4662-8246 e-mail: gazoh@campuscreate.com